# 一、液体电介质的电导

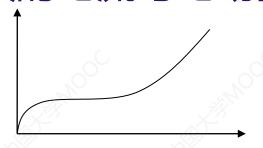
◆液体电介质的电导

纯净液体电介质, 电阻率P:10<sup>14</sup>~10<sup>16</sup>Ω·m

工程液体电介质,电阻率 $P:10^9 \sim 10^{13}\Omega \cdot m$ 

## 一、液体电介质的电导

液体电介质的电流与电场强度的关系:



极性液体电介质的电阻率较非极性电介质低。

弱场: I—E呈线性关系,符合欧姆定

建流: 没有明显的电流饱和现象。

#### 一、液体电介质的电导

强场: I随E呈指数增加。

原因:液体密度大,离子迁移小,并且在液体中离子相遇的机会多,复合几率大,使离子不易全部到达电极形成电流。因此  $E^{\uparrow}$ ,  $j^{\uparrow}$ ,液体电介质的载流子主要是离子和带电胶粒,液体电导这样就有离子电导和电泳电导(胶粒电导)。

◆液体电介质中的离子电导

本征离子:液体分子本身解离而产生的离子(强极性液体)。

液体分子解离主要是热解离和外电离因素(包括紫外线、宇宙射线)。

杂质离子: 外来杂质分子或液体的基本分子老化的产物离解而生成的离子。

本征离子电导(漏导)很小,杂质离子是漏导的主要来源。

#### 液体的特征:

- (1) 液体分子间有强烈的互作用力,分子间的距离接近于固体,因而具有大的凝聚力和小的压缩性,处于凝聚状态。
- (2) 液体分子作用力比晶体小,不足以阻止分子间的相对滑移。因此具有流动性,没有固定形状。

气体完全无序,晶体远程有序,液体介于完全无序和完全有序之间,即近程有序。

在1~3nm内作规则排列。

由于分子间相互强烈的作用,在短暂时间内束缚在一起形成有序结构。

其间分子在它的平衡位置上作热振动,由于分子热运动的涨落,在某一瞬分子热振动能量足够大,分子就发生了迁移,这就使原来的有序结构被破坏,而在邻近的另一处又形成了短暂的有序结构。并且充满着无数个存在时间短暂的近程有序结构。

由于分子热运动的涨落,同时又不时地发生迁移破坏这种有序结构。 液体分子、离子要迁移,必须克服相 互作用势垒的阻碍,但它们在各个方 向迁移的几率相同。

在电场作用下,液体电介质离子在电场方向产生了定向迁移,形成漏导电流。

1、离子迁移率:离子定向迁移,形成漏导电流。

单位体积中单位时间内沿电场E 方向迁移的载流子数  $\Delta n$ 

$$\Delta n = \frac{n}{6} \nu \left[ e^{-(U - \Delta U)/KT} - e^{-(U + \Delta U)/KT} \right]$$

- n 为单位体积中离子数。
- v 为离子在平衡位置的振动频率。

在弱场作用下  $e^{\pm \Delta U/KT} \approx 1 \pm \Delta U/KT$   $\Delta U = q\delta E/2$   $\Delta n \approx \frac{nq\delta v}{6KT} e^{-U/KT} E$ 

δ 为离子每次迁移的平均迁移距离。

δΔn 为n个载流子在电场方向单位时间内迁移的距离。

#### 1个离子在电场方向宏观 平均漂移速率

$$v = \frac{\delta \Delta n}{n} = \frac{q \delta^2 v}{6KT} e^{-U/KT} E$$

迁移率 
$$\mu = \frac{v}{E} = \frac{q\delta^2 v}{6KT}e^{-U/KT}$$

约 
$$10^{-6} \sim 10^{-8} \, m^2 / s \cdot v$$

通过测量不同温度下离子的迁移率可求得势垒U。

一般而言,液体中,本征离子的势垒大于杂质离子的势垒。

2、离子电导率与温度关系:

离子电导率: 
$$\gamma = nq\mu = \frac{nq^2\delta^2}{6KT}ve^{-U/KT}$$

由于温度的影响,其指数部分远大于分数部分,故把分数部分近似看成与温度无关的常数。

$$\gamma = Ae^{-B/T}$$
  $A = \frac{nq^2\delta^2v}{6KT}$   $B = U/K$   $T \uparrow$ ,  $\gamma \uparrow$ , 工程上用摄氏温标  $t$  表示。  $\gamma = Ae^{-B/273+t} = Ae^{-B(273-t)/273^2-t^2}$  温度不高时  $t^2 << 273^2$   $\gamma \approx Ae^{-B(273-t)/273^2} = Ae^{-\frac{B}{273} + \frac{B}{273^2}t}$ 

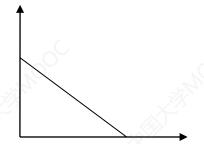
 $\gamma = Ce^{at}$   $C = Ae^{-\frac{B}{273}}$   $a = B/273^2$ 

考虑到杂质离子的电导 $\gamma = A_1 e^{-B_1/T} + A_2 e^{-B_2/T}$ 

A<sub>1</sub>、B<sub>1</sub>和A<sub>2</sub>、B<sub>2</sub>为本征离子电导和杂质离子电导的有关常数。

对于工程液体电介质,本征离子的迁移势垒U比杂质离子的迁移势垒大很多,杂质离子电导往往占主导地位。

$$\ln \gamma = \ln A - \frac{B}{T}$$



为一条直线,有些液体为两条直线构成。

◆电泳电导(尘埃、气泡、水份、 液滴及固体杂质颗粒) 线度在1~100nm范围内的颗粒悬浮 在分散液体介质中成为胶粒。 加电场以后,胶粒沿电场方向漂移, 形成电流,称电泳电导,或胶粒电导。

胶粒是带电的,与胶粒所带电荷数量相等,符号相反的异号离子,构成双电层——扩散的双电层模型。

电泳电导 
$$\gamma = nq\mu = \frac{8\pi n \varepsilon_0^2 \varepsilon_r^2 r \xi^2}{3} \frac{1}{\eta} = b \frac{1}{\eta}$$
 $b$  近似于温度无关。

$$\eta = ae^{U/KT}$$
  $\gamma = Ae^{-B/T}$   $T \uparrow$  ,  $\gamma \uparrow$   $r\eta = b$ 

电泳电导 / 与液体粘度系数 / 乘积与温度无关——华尔顿定律。

本征离子电导率也服从华尔顿定律。

杂质离子电导率不服从华尔顿定律。

液体电介质击穿的两个条件:初始电子的存在,足够高的电场。

这两个条件促使碰撞电离过程能不断地发生和增长,直至贯穿电极间的液体,同时诸多外界因素对击穿有很大影响。

外界因素对击穿过程和击穿电压的影响:

- (1) 溶解气体的影响 某些溶解的气体对液体电介质的击穿 强度有重大影响。
- (2) 压力的影响 液体击穿场强与压力有关。

- (3) 电极的影响 电极面积的影响,击穿强度随电极 面积增加而减小。 电极材料与表面状态的影响。
- (4) 潮气的影响 液体介质中含有水分时,击穿场强 显著下降。